

VERBALE COMMISSIONE DI GARA

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA **FORNITURA, CONSEGNA, POSA IN OPERA, MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, FE-SEM)** – RDO N. 1930422 - CIG N. 7409897870

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di giugno alle ore dieci e venti in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano della sede del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (ex palazzina Chimica applicata ed. RM038) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via Eudossiana 18, si sono riuniti, in seduta riservata, i componenti della Commissione giudicatrice della procedura negoziata **PER LA FORNITURA, CONSEGNA, POSA IN OPERA, MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, FE-SEM)** – RDO N. 1930422 - CIG N. 7409897870, tale nominata con provvedimento del Responsabile Amministrativo Delegato n. 127/2018 in data 8/6/18 e così composta:

-Dott. Andrea Putignani, Direttore dell'Area Affari Istituzionali di questo Ateneo, nella qualità di Presidente;

-Ing. Andrea Brotzu, Cat. D4 – Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, nella qualità di membro;

-Dott. Simone Chicarella, Cat. D1, – Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, nella qualità di membro.

Dopo aver esaminato congiuntamente il Capitolato speciale d'appalto e il Disciplinare di gara, la Commissione prende atto dei criteri e delle modalità di valutazione previste da quest'ultimo, nonché delle specifiche modalità di attribuzione dei punteggi. Procede,

quindi, con l'esame dell'offerta tecnica dell'operatore economico ASSING SPA ammesso al prosieguo della gara in seguito all'esame della documentazione amministrativa, e all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione, esaminata l'offerta tecnica, rileva che la medesima è dettagliata e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

In particolare, con specifico riferimento agli elementi di valutazione previsti nel disciplinare, la Commissione rileva che le caratteristiche offerte sono come di seguito e attribuisce i seguenti punteggi:

	<b>Criteri</b>	<b>Punteggio Max</b>	<b>Sub-Criteri e relativi punteggi SubT(a)<sup>(*)</sup></b>	<b>Caratteristiche offerte</b>	<b>Punteggio commissione</b>
T1	Risoluzione garantita a 30kV	4	2 punti se <1.5nm e ≥1.2nm 4 punti se <1.2nm	1.0nm	4
T2	Risoluzione garantita a 3kV	4	2 punti se <3.5nm e ≥2.5 nm 4 punti se < 2.5nm	2.0nm	4
T3	Tensione di accelerazione minima	2	1 punto se <500eV e ≥ 300eV 2 punti se < 300eV	200eV	2
T4	Step minimo della tensione di accelerazione	3	0 punti se ≥ 100eV sull'intero range 1 punto se <100eV e ≥ 10eV	In continua	3
T5	Risoluzione massima dell'immagine	4	2 punti se >4k x 4k e ≤ 8k x 8k pixel 4 punti se >8k x 8K pixel	16K X16K pixel	4
T6	Ingrandimento minimo	6	1 punto se l'ingrandimento minimo è <15X e ≥10X 3 punti se l'ingrandimento minimo è <10X e ≥3X 6 punti se <3X	1X	6
T7	Field of view alla distanza di lavoro analitica	4	0 punti se < 4mm 2 punti se >4 mm e ≤ 6mm 4 punti se > 6mm	6.4mm	4

			1 punto se in colonna sono previste aperture discrete (diaframmi) selezionabili manualmente	In colonna non sono previste aperture discrete	
T8	Selezione del diametro e della corrente di fascio	6	2 punti se in colonna sono previste aperture discrete (diaframmi) selezionabili via software 6 punti se in colonna non sono previste aperture discrete (diaframmi)		6
T9	Massima corrente di fascio	8	2 punti se >20nA e ≤50nA 4 punti se >50nA e ≤100nA 6 punti se >100nA e ≤150nA 8 punti se >150nA	200nA	8
T10	Diametro interno (o diagonale interna) della camera di lavoro	6	1 punto se >300mm e ≤350mm 3 punti se >350mm e ≤400mm 6 punti se > 400mm	446,9mm	6
T11	Rivelatore degli elettroni retrodiffusi	6	0 punti se allo stato solido a 2 settori 3 punti se allo stato solido a 4 o più settori 6 punti se a scintilla-	Rivelatore degli elettroni retrodiffusi a scintillazione con cristallo YAG	6
T12	Numero di porte in camera per tecniche accessorie	6	1 punto se >6 e ≤8 3 punti se >8 e ≤10 6 punti se >10	12	6
T13	Escursioni del tavolino motorizzato sugli assi X e Y	6	2 punti se X +Y = 220mm 4 punti se X+Y > 220 e < 250mm	260mm	6
T14	Escursione del tavolino sull'asse Z	6	2 punti se >50mm e ≤70mm 4 punti se >70mm e ≤90mm 6 punti se > 90mm	100mm	6
T15	Software aggiuntivi	2	2 punti se è prevista la possibilità di ottenere immagini stereoscopiche "live" da abbinare ad eventuali pacchetti metrologici per misure certificate.	Si, incluso Live 3D Imaging	2
T16	Pannello di controllo (consolle multifunzione per la gestione dei parametri del SEM)	2	2 punti se presente nella configurazione	Incluso	2
	<b>TOTALE</b>	<b>75</b>			<b>75</b>

La Commissione prende atto che il sistema consente l'attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 73 in quanto 2 punti sono riservati ad attribuzione automatica da sistema (allega screenshot da portale MePA).

Alle ore 10.58 la Commissione conclude i lavori e chiude la seduta riservata.

Il presente verbale, composto di 4 pagine, è approvato all'unanimità e sottoscritto dalla  
Commissione seduta stante.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott. Andrea Putignani \_\_\_\_\_

**I MEMBRI**

f.to Ing. Andrea Brotzu \_\_\_\_\_

f.to Dott. Simone Chicarella \_\_\_\_\_

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale

art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993